

新技術説明会

見える粒子計測による分散安定性評価 ～ゼータ電位と粒径分布～

Zeta potential and particle size measurement with real time observation

日時: 9月2日(木曜日) 15:50~16:15

場所: 分析展2010 新技術説明会
(アパホテル&リゾート東京ベイ幕張内) 部屋番号A-10

確かな技術で未来を分析

分析展2010
Analytical Instrumenta & Solutions Expo

明日を拓く科学技術

科学機器展2010
Scientific Instruments Show

新型 ZEECOM ZC-3000の多機能が見えてくる!

株式会社マイクロテック・ニチオンでは、分析展2010 新技術説明会で「見える粒子計測による分散安定性評価～ゼータ電位と粒径分布～」と題して、粒子観察に適した光学系と画像解析を用いたゼータ電位・粒径分布測定機 ZEECOM の紹介を測定の事例とともにご紹介いたします。

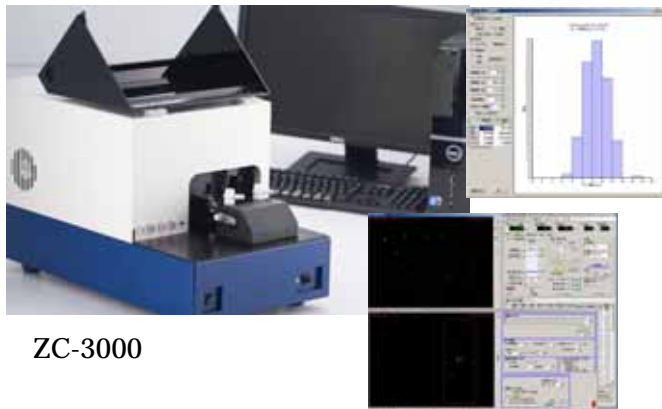
入場無料

(当日、分析展2010への入場登録をお済ませのうえ、直接説明会場までご来場下さい。)

定員100名様まで

(定員を超えた場合にはご入場できません。お早めにご来場下さい。)

競合会社の聴講不可



ZC-3000

会場アクセス



(お問い合わせ・聴講お申込みは)



未知への挑戦

株式会社 マイクロテック・ニチオン

〒274-0074 千葉県船橋市滝台 2-16-5

TEL047-466-8186 FAX047-466-8190

E-mail: microtec@niton.com

URL <http://niton.com/>